

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との JIS素案作成委員会(WG) 対応の程度	作成開始 予定	
JSA	05 電気	廃止	C2138	電気絶縁材料—比誘電率及び誘電正接の測定方法	Electrical insulating materials— Methods for the determination of the relative permittivity and dielectric dissipation factor	この規格は、固体絶縁物の比誘電率、誘電正接を、15Hz～300MHzの周波数範囲で測定する方法について規定するものであり、IEC 60250:1969を対応国際規格として、2007年制定された。近年、デジタル計測技術の発展などによって、測定可能周波数がより低い周波数まで伸びたこと、全周波数領域においてより高い精度の測定が可能になったことなど、測定装置の技術的進歩に伴って、特に測定周波数が高い領域(1MHz～300MHz)において高い精度で測定を実施するためには、高周波数領域での特有の測定手順を標準化する必要性が生じてきた。一方、低い周波数領域では、測定可能周波数の下限領域が伸びて、0.1Hzまで高い精度の測定が可能となってきた。 このようなことを背景にして、特に高い周波数領域での測定における特別な測定手順を盛り込んで規定するため、対応国際規格であるIEC 60250は廃止され、測定周波数を低周波領域(0.1 Hz～10 MHz)と高周波領域(1 MHz～300 MHz)とに分けて、それぞれの周波数領域での測定方法について、新たにIEC 62631-2-1:2018及びIEC 62631-2-2:2022が制定された。 我が国においても、固体絶縁材料の基本的な特性の一つである比誘電率及び誘電正接の測定方法に関して国際規格との整合性を図るとともに、最近の技術の実態に即し、測定器の性能や機能の向上に対応するため、新たに二つの周波数領域における測定方法を別々に規定したJISを制定し、この規格を廃止する。	-	-	一般社団法人電気学会 のWG	2024年1月
JSA	06 電子	廃止	C4556	工業用電子カウンタ	Electronic counter for industrial use	これから廃止に着手し、来年度中に廃止公示予定であるため。 【廃止する理由】工業用電子カウンタ機器としては、IEC 61010を利用するのが一般的であるため。	-	-	一般社団法人日本電気 制御機器工業会のWG	-

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	06 電子	廃止	C5070	表面実装技術－表面実装部品(SMD)の輸送及び保管条件－指針	Surface mounting technology－ Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD)－ Application guide	この規格は、IEC 61760-2を対応国際規格とするJISである。IEC 61760-2の主要な規定である、表面実装部品の輸送、保管時の環境条件の分類、環境パラメータ及びその厳しさなどの規定が、社会環境の変化に合わせて全面的に改訂され2021年に発行された。JISとしても規格としての取り込みを予定しているが、これを機会に、IEC 61760-2の整合規格であることを明確にするため規格番号をJIS C 61760-2に改めて制定を申請する予定である。JIS C 61760-2の制定と同時に、この規格は廃止とする。	IEC 61760-2:2007	IDT	一般社団法人電子情報 技術産業協会のWG	
JSA	07 情報	廃止	C5750-1	ディペンダビリティマネジメント－ 第1部:ディペンダビリティマネジメントシステム	Dependability management - Part 1: Dependability management system	IEC 60300シリーズに対応するJISであるC5750シリーズのうち、主要5規格が現在IECで改訂及び作成作業中である。C5750シリーズの規格番号を対応国際規格に合わせてC60300としたいという強い要望を委員会から受けた。最上位規格IEC 60300-1に対応するC5750-1の規格番号をC60300-1にして、続く4規格もC60300シリーズとすることが、日本における総合信頼性(ディペンダビリティ)JISの普及にも役立つことから、この規格を廃止し、新たにC60300-1として制定する。	IEC 60300-1	IDT	一般財団法人日本規格 協会のWG	2024年4月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	07 情報	廃止	C5750-2	ディペンダビリティマネジメントー 第2部:ディペンダビリティマネジメントのための指針	Dependability management - Part 2: Guidelines for dependability management	JIS C 5750-2:2010 (IEC 60300-2:2004) は、ディペンダビリティ(総合信頼性)マネジメントシステム規格であるJIS C 5750-1:2010 (IEC 60300-1:2003)を補助し、適用の指針及び方法を提供する規格である。2014年、これらの対応国際規格は統廃合され、IEC 60300-2は既に廃止されている。また、統合後のIEC 603001-1は、最近の市場の実態などを踏まえて2023年に改訂されることから、JIS C 5750-1がIEC 60300-1:2023の一致規格として改正されるため、それと同時にこの規格は廃止する。	IEC 60300-2:2004	MOD	一般財団法人日本規格協会のWG	2023年7月
JSA	06 電子	廃止	C5940	光伝送用半導体レーザー通則	General rules of laser diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザー(電子回路内蔵形を除く。)の用語、分類、最大定格、性能などの一般の共通事項について規定するものである。対応国際規格は、IEC 60747-5 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices:1992年制定、1995年修正2版発行)である。なお、IEC 60747-5の一部として含まれていた半導体レーザーについては、2006年にIEC 60747-5-4 (Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers:2006年制定、2022年改訂)に移行している。また、JIS C 5940に関連するJISとしてJIS C 5944 (光伝送用半導体レーザーモジュール通則)が制定されており、対応国際規格はIEC 62007-1 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics;1997年制定、2015年改訂)である。 JIS C 5940 (JIS C 5944も同様)では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が規定されている(JIS C 5944では数値は推奨値となっている)。しかし、IEC 60747-5-4ではJISとは異なり、定格及び性能について規定すべき事項だけを規定し個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い(IEC 62007-1も同様)。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、半導体レーザーと半導体レーザーモジュールは共通事項が多いことから、JIS C 5940と関連したJIS C 5944の両JISの内容を包含した1つの規格とすることで規格利用者の利便性向上を図り、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることとしJIS C 5955規格群(性能標準テンプレート)における新たな規格(JIS C 5955-4)を制定する。これに伴い重複するJIS C 5940を廃止する。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747 -5:1992/AMENDMEN T 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747 -5:1992/AMENDMEN T 2:1995 Amendment 2 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との JIS素案作成委員会(WG) 対応の程度	作成開始 予定	
JSA	06 電子	廃止	C5941	光伝送用半導体レーザー測定方法	Measuring methods of laser diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザー(電子回路内蔵型を除く。ただし、必要に応じモニタ用フォトダイオードを含む。)の測定方法を規定しているものである。この規格の対応国際規格はIEC 60747-5:1992(Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices)であるが、この中にあった半導体レーザーの測定方法について、基本特性測定方法についてはIEC 60747-5-4 (Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers 2006年制定 2022年改訂)に、光伝送用に特化した測定方法は光伝送用半導体部品の測定方法を集めたIEC 62007-2 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods 1997年制定 2009年改訂)に包含された。IEC 62007-2では光伝送用半導体レーザー、光伝送用半導体レーザーモジュール、光伝送用発光ダイオード及び光伝送用フォトダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて規定している。IEC 62007-2制定の際に半導体レーザーの基本特性測定方法はIEC 60747-5に残され、2006年にIEC 60747-5-4に置き換えられた。このため、IEC規格ではIEC 60747-5-4に規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。 また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5941(光伝送用半導体レーザー測定方法)に加え、JIS C 5945(光伝送用半導体レーザーモジュール測定方法)、JIS C 5951(光伝送用発光ダイオード測定方法)及びJIS C 5991(光伝送用フォトダイオード測定方法)がIEC 60747-5に対応している。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じていることから、規格利用者の混乱を避けるとともに1つのJISとすることで利便性を向上させるため、現行規格JIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複するJIS C 5941は廃止とする。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 2:1995 Amendment 2 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5944	光伝送用半導体レーザーモジュール通則	General rules of laser diode modules for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザーモジュールの用語、最大定格、性能などの一般的共通事項について規定したものである。対応国際規格は、IEC 62007-1 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics; 1997年制定、2015年改訂)である。JIS C 5944に関連するJISとしてJIS C 5940(光伝送用半導体レーザー通則)が制定されており、対応国際規格は、IEC 60747-5 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices: 1992年制定、1995年修正2版発行)である。なお、IEC 60747-5の一部として包含されていた半導体レーザーについては、2006年にIEC 60747-5-4 (Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers: 2006年制定、2022年改訂)に移行している。 JIS C 5944 (JIS C 5940も同様)では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が推奨値として示されている (JIS C 5940では示されている数値の範囲は規定となっている)。しかし、IEC 62007-1ではJISとは異なり、定格及び性能について規定すべき事項だけを規定し個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い (IEC 60747-5-4も同様)。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、半導体レーザーモジュールと半導体レーザーは共通事項が多いことから、JIS C 5944と関連したJIS C 5940の両JISの内容を包含した1つの規格とすることで規格利用者の利便性向上を図り、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることしJIS C 5955規格群(性能標準テンプレート)における新たな規格 (JIS C 5955-4)を制定する。これに伴い重複するJIS C 5944を廃止する。	IEC 62007-1:1999 Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との JIS素案作成委員会(WG) 対応の程度	作成開始 予定	
JSA	06 電子	廃止	C5945	光伝送用半導体レーザーモジュール測定方法	Measuring methods of laser diode modules for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用半導体レーザーモジュール(光ファイバピグテイル又は光ファイバ接続用のレセプタクルをもち、必要に応じモニタ用フォトダイオード、電子冷却素子、温度センサ、光アイソレータなどの簡単な素子を内蔵するものである。)の測定方法を規定している。この規格の対応国際規格IEC 62007-2 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods)はIEC 60747-5:1992(Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices)の中で光伝送用に特化した測定方法を抽出して規定したもので1997年に制定され、光伝送用半導体レーザーモジュール以外に、光伝送用半導体レーザー、光伝送用発光ダイオード及び光伝送用フォトダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて記載している。半導体レーザー及び半導体レーザーモジュールの基本特性測定方法はIEC 62007-2制定の際にIEC 60747-5に残され、2006年にIEC 60747-5-4 (Semiconductor devices - Part 4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers)に置き換えられた。このため、IEC規格ではIEC 60747-5-4に規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。 また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5945 (光伝送用半導体レーザーモジュール測定方法)に加え、JIS C 5941 (光伝送用半導体レーザー測定方法)、JIS C 5951 (光伝送用発光ダイオード測定方法)及びJIS C 5991 (光伝送用フォトダイオード測定方法)がIEC 60747-5に対応している。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じていることから、規格利用者の混乱を避けるとともに1つのJISとすることで利便性を向上させるため、現行規格JIS C 5945、JIS C 5941、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複するJIS C 5945は廃止とする。	IEC 62007-2:1996 Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5950	光伝送用発光ダイオード通則	General rules of light emitting diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用発光ダイオード(電子回路内蔵形を除く)の用語、記号、分類、最大定格、性能などの一般の共通事項について規定したものである。この規格の対応国際規格はIEC 60747-5:1992+AMD1:1994 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices)であるが、IEC 60747-5の一部として包含されていた光伝送用発光ダイオードは1997年に他の光伝送用半導体部品とともに光伝送用半導体部品に特化したIEC 62007-1 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics)に定格及び性能が包含された。 JIS C 5950では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が規定されている。一方、IEC 62007-1では、JIS C 5950とは異なり、光伝送用発光ダイオードの定格と性能について規定すべき事項だけを規定し、個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることとしJIS C 5955規格群(性能標準テンプレート)における新たな規格(JIS C 5955-5)を制定する。これに伴い重複するJIS C 5950を廃止する。	IEC 60747-1:1983 Semiconductor devices - Discrete devices - Part 1: General IEC 60747-1:1983/AMENDMENT 1:1991 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 1: General, IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	06 電子	廃止	C5951	光伝送用発光ダイオード測定方法	Measuring methods of light emitting diodes for fiber optic transmission	この規格は、光源として使用する光伝送用発光ダイオード(電子回路内蔵型を除く。)の測定方法を規定している。この規格の対応国際規格はIEC 60747-5:1992(Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices)であるが、この中にあった光伝送用発光ダイオードの測定方法について、基本特性測定方法はIEC 60747-5-6(Semiconductor devices - Part 5-6: Optoelectronic devices - Light emitting diodes 2016年制定 2021年改訂)に、光伝送用に特化した測定方法は光伝送用半導体部品の測定方法を集めたIEC 62007-2(Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods 1997年制定 2009年改訂)に包含された。IEC 62007-2では、光伝送用発光ダイオード以外に、光伝送用半導体レーザ、光伝送用半導体レーザモジュール及び光伝送用フォトダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて規定している。IEC 62007-2制定の際に発光ダイオードの基本特性測定方法はIEC 60747-5に残され、2016年にIEC 60747-5-6に置き換えられた。このため、IEC規格ではIEC 60747-5-6に規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。 また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5951(光伝送用発光ダイオード測定方法)に加え、JIS C 5941(光伝送用半導体レーザ測定方法)、JIS C 5945(光伝送用半導体レーザモジュール測定方法)及びJIS C 5991(光伝送用フォトダイオード測定方法)がIEC 60747-5に対応している。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じていることから、規格利用者の混乱を避けるとともに1つのJISとすることで利便性を向上させるため、現行規格JIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複するJIS C 5951は廃止とする。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747 -5:1992/AMENDMEN T 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C5952-4	光伝送用能動部品—パッケージ及びインタフェース標準—第4部: PNコネクタ付1×9ピンプラスチック光ファイバ光トランシーバ	Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 4: PN 1x9 plastic optical fibre transceivers	対応国際規格が廃止されているため。	-	-	無	2022年12月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	06 電子	廃止	C5952-7	光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－第7部：LCコネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ	Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 7: SFF LC 10-pin transceivers	この規格は、LCコネクタ付10ピンSFF形光トランシーバの物理インターフェース仕様について規定したものである。10ピンSFF形光トランシーバに関するJISには、ほかにこの規格群のパート2及びパート9があり、JIS C 5952-2の対応国際規格であるIEC 62148-2が2010年に、JIS C 5952-7の対応国際規格(IEC 62148-7:2003 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 7: SFF LC 10-pin transceivers)及びJIS C 5952-9の対応国際規格(IEC 62148-9:2003 Fibre optic active components and devices-Package and interface standards-Part 9 : SFF MU duplex 10-pin transceivers)を包含して改訂し、同時にIEC 62148-7及びIEC 62148-9は廃止された。このため、現状10ピンSFF光トランシーバ関連のJISとIEC規格との規格構成を合わせるために、国内においても、JIS C 5952-7及びJIS C 5952-9をJIS C 5952-2に纏める形で改正することとなった。またこれに伴い、この規格及びJIS C 5952-9は廃止する必要がある。	IEC 62148-7:2003	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2023年12月
JSA	06 電子	廃止	C5952-8	光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－第8部：LCコネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ	Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 8: SFF LC 20-pin transceivers	この規格は、LCコネクタ付20ピンSFF形光トランシーバの物理インターフェース仕様について規定したものである。20ピンSFF形光トランシーバに関するJISには、ほかにこの規格群のパート8及びパート10があり、JIS C 5952-3の対応国際規格であるIEC 62148-3が2010年に、JIS C 5952-8の対応国際規格(IEC 62148-8:2003 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 8: SFF LC 20-pin transceivers)及びJIS C 5952-10の対応国際規格(IEC 62148-10:2003 Fibre optic active components and devices-Package and interface standards-Part 10 : SFF MU duplex 20-pin transceivers)を包含して改訂し、同時にIEC 62148-8及びIEC 62148-10は廃止された。このため、現状20ピンSFF光トランシーバ関連のJISとIEC規格との規格構成を合わせるために、国内においても、JIS C 5952-8及びJIS C 5952-10をJIS C 5952-3に纏める形で改正することとなった。またこれに伴い、この規格及びJIS C 5952-10は廃止する必要がある。	IEC 62148-8:2003	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2023年12月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	06 電子	廃止	C5952-9	光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－第9部：MU(F14形)コネクタ付10ピンSF F形光トランシーバ	Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 9: SFF MU duplex 10-pin transceivers	この規格は、MU2心コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバの物理インタフェース仕様について規定したものである。JIS C 5952-2の対応国際規格であるIEC 62148-2の2010年に、JIS C 5952-7の対応国際規格 (IEC 62148-7:2003 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 7: SFF LC 10-pin transceivers) 及びJIS C 5952-9の対応国際規格 (IEC 62148-9:2003 Fibre optic active components and devices-Package and interface standards-Part 9 : SFF MU duplex 10-pin transceivers) を包含して改訂し、同時にIEC 62148-7及びIEC 62148-9は廃止された。このため、現状10ピンSFF光トランシーバ関連のJISとIEC規格との規格構成を合わせるために、国内においても、JIS C 5952-7及びJIS C 5952-9をJIS C 5952-2に纏める形で改正することとなった。またこれに伴い、この規格及びJIS C 5952-7は廃止する必要がある。	IEC 62148-9:2003	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2023年12月
JSA	06 電子	廃止	C5952-10	光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－第10部：MU(F14形)コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ	Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 10: SFF MU duplex 20-pin transceivers	この規格は、MU2心コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバの物理インタフェース仕様について規定したものである。20ピンSFF形光トランシーバに関するJISには、ほかにこの規格群のパート8及びパート10があり、JIS C 5952-3の対応国際規格であるIEC 62148-3が2010年に、JIS C 5952-8の対応国際規格 (IEC 62148-8:2003 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 8: SFF LC 20-pin transceivers) 及びJIS C 5952-10の対応国際規格 (IEC 62148-10:2003 Fibre optic active components and devices-Package and interface standards-Part 10 : SFF MU duplex 20-pin transceivers) を包含して改訂し、同時にIEC 62148-8及びIEC 62148-10は廃止された。このため、現状20ピンSFF光トランシーバ関連のJISとIEC規格との規格構成を合わせるために、国内においても、JIS C 5952-8及びJIS C 5952-10をJIS C 5952-3に纏める形で改正することとなった。またこれに伴い、この規格及びJIS C 5952-8は廃止する必要がある。	IEC 62148-10:2003	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2023年12月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は, 現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は, 現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	06 電子	廃止	C5953-6	光伝送用能動部品—性能標準— 第6部:650nm, 250Mbit/sプラス チック光ファイバ伝送用光トラン シーバ	Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers	対応国際規格が廃止されているため。	-	-	無	2022年12月
JSA	06 電子	廃止	C5990	光伝送用フォトダイオード通則	General rules of photodiodes for fiber optic transmission	この規格は、光伝送用フォトダイオード(電子回路内蔵形を除く。)の用語、記号、分類、最大定格、性能などの一般的共通事項について規定したものである。この規格の対応国際規格は、IEC 60747-5:1992+AMD1:1994 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices)であるが、1997年にIEC 60747-5の一部として包含されていた光伝送用フォトダイオードは他の光伝送用半導体部品とともに光伝送用半導体部品に特化したIEC 62007-1 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics)に定格と性能とが包含された。 JIS C 5990では定格及び性能に加え環境試験及び耐久性試験についても項目が規定されており、さらに規定値として記述すべき数値の範囲や性能の試験条件として与えるべき数値の範囲が推奨値として示されている。しかし、IEC 62007-1では、JIS C 5990とは異なり、光伝送用フォトダイオードの定格と性能について規定すべき事項だけを規定し、個々の数値については規定せず、環境試験及び耐久性試験については規定が無い。これは光伝送用部品に関するIEC規格が、個々に規定すべき性能は応用により異なることから部品ごとの性能標準テンプレートは最小限の共通事項のみを規定する、及び環境試験及び耐久性試験も応用ごとに異なるので個々の応用ごとに対応した性能標準テンプレート又は性能標準で規定するという体系に変わってきたことによるものである。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じているので、混乱を避けるために新たにIEC規格と整合したJISの制定が必要である。そのため、IEC規格と整合した性能標準テンプレートとすることしJIS C 5955規格群(性能標準テンプレート)における新たな規格(JIS C 5955-6)を制定する。これに伴い重複するJIS C 5990を廃止する。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747 -5:1992/AMENDMEN T 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技 術振興協会のWG	2024年4月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との JIS素案作成委員会(WG) 対応の程度	作成開始 予定	
JSA	06 電子	廃止	C5991	光伝送用フォトダイオード測定方法	Measuring methods of photodiodes for fiber optic transmission	この規格は、光伝送用フォトダイオード(電子回路内蔵形を除く。)の測定方法について規定している。この規格の対応国際規格IEC 60747-5:1992 (Semiconductor devices, Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices)であるが、この中にあった光伝送用フォトダイオードの測定方法について、基本特性測定方法はIEC 60747-5-7 (Semiconductor devices - Part 5-7: Optoelectronic devices - Photodiodes and phototransistors 2016年制定)に、光伝送用に特化した測定方法は光伝送用半導体部品の測定方法を集めたIEC 62007-2 (Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods 1997年制定 2009年改訂)に包含された。IEC 62007-2では、光伝送用フォトダイオード以外に光伝送用半導体レーザー、光伝送用半導体レーザーモジュール及び光伝送用発光ダイオードを、発光デバイスと受光デバイスという分類で纏めて記載している。IEC 62007-2制定の際に光伝送用フォトダイオードの基本特性測定方法はIEC 60747-5に残され、2006年にIEC 60747-5はIEC 60747-5-6に置き換えられた。このため、IEC規格ではIEC 60747-5-7に規定されている基本特性測定方法とIEC 62007-2に規定されている測定方法を共に参照する必要がある。 また、JISにおける光伝送用半導体部品の測定方法は、JIS C 5991 (光伝送用フォトダイオード測定方法)に加え、JIS C 5941 (光伝送用半導体レーザー測定方法)、JIS C 5945 (光伝送用半導体レーザーモジュール測定方法)、及びJIS C 5951 (光伝送用発光ダイオード測定方法)がIEC 60747-5に対応している。 このようにIEC規格とJISとの対応関係に不整合が生じており、規格利用者の混乱を避けるとともに1つの規格とすることで利便性を向上させるため、現行規格JIS C 5941、JIS C 5945、JIS C 5951及びJIS C 5991を包含し、現行IEC規格と整合した測定方法を新たにJIS C 5954-8として制定する。これに伴い重複するJIS C 5991は廃止とする。	IEC 60747-5:1992 Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices, IEC 60747-5:1992/AMENDMENT 1:1994 Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits - Part 5: Optoelectronic devices	MOD	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2024年4月
JSA	06 電子	廃止	C60068-2-77	環境試験方法－電気・電子－表面実装部品(SMD)の本体強度及び耐衝撃性試験方法	Environmental testing－Part 2-77: Tests－Test 77: Body strength and impact shock	この規格の対応国際規格である“IEC 60068-2-77”が“IEC 60068-2-21”へ統合されたため、JISにおいても“JIS C 60068-2-77”を“JIS C 60068-2-21”へ統合する改正を行い、この規格を廃止とする。	IEC 60068-2-77:1999	IDT	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	-

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は, 現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は, 現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	05 電気	廃止	C60695-6-30	環境試験方法－電気・電子－火災危険, 火災のもつ潜在的・偶発的危険の試験方法－火災に遭った電気製品からの煙による光の不透過度に起因する視界のさえぎりの評価に関する指針及び試験方法: 小規模静的試験方法－煙による光の不透過度測定－試験装置の記述	Fire hazard testing - Part 6: Guidance and test methods on the assessment of obscuration hazard of vision caused by smoke opacity from electrotechnical products involved in fires - Section 30: Small scale static method - Determination of smoke opacity -- Description of the apparatus	この規格と引用関係にあったC60695-6-30の発煙濃度試験方法がC3612(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)の改正によって、C3612の附属書A(発煙濃度試験方法)に規定され、この規格を引用していた他の電線・ケーブル規格についてもC3612を引用する改正が行われた。また、この規格を引用していたC60695-6-1は、同時改正によって、この規格との引用関係が解消されるため、この規格を廃止する。なお、対応国際規格は、既に廃止されている。	IEC 60695-6-30:1996	IDT	一般財団法人日本規格協会のWG	-
JSA	05 電気	廃止	C60695-6-31	環境試験方法－電気・電子－耐火性試験－煙による光の不透過度の測定－小規模静的試験方法－材料	Environmental testing - Electrotechnical products - Fire hazard testing - Smoke obscuration - Small scale static method - Materials	この規格に規定されていた発煙濃度試験方法がC3612(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)の改正によって、C3612の附属書A(発煙濃度試験方法)に規定され、この規格を引用していた他の電線・ケーブル規格についてもC3612を引用する改正が行われた。また、この規格を引用していたC60695-6-1は、同時改正によって、この規格との引用関係が解消されるため、この規格を廃止する。なお、対応国際規格は、既に廃止されている。	IEC 60695-6-31:1999	IDT	一般財団法人日本規格協会のWG	-

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は、現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は、現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との JIS素案作成委員会(WG) 対応の程度	作成開始 予定
JSA	07 情報	廃止	X4163	フォント情報交換 第3部 グリフ 形状表現	Information technology—Font information interchange Part 3 : Glyph shape representation	これから廃止に着手し、来年度中に廃止公示予定であるため。 【廃止する理由】関連規格が廃止されており、この規格の必要性 がなくなったため。	-	一般社団法人ビジネス機 械・情報システム産業協 会のWG	-
JSA	07 情報	廃止	X5092	CMS利用電子署名(CAdES)の 長期署名プロファイル	Long term signature profiles for CMS advanced electronic signatures (CAdES)	JIS X 5092:2008が元となった国際規格ISO 14533-1が、関連す る規格としてJIS X 5093:2008が元となったISO 14533-2が発行さ れている。ISO 14533-1及びISO 14533-2は、欧州規格との整合 化のため、改訂が行われており、JIS X 5092:2008及びJIS X 5093:2008も同様に改定が必要となっている。一方、ISO 14533シ リーズとしてISO 14533-3が発行されているが、対応するJISがない ことから、そのJISの制定も望まれている。 今回、JIS X 5092:2008 の内容を更新するとともに、国際規格と JIS との関連性を明確化するために、規格番号を国際規格に合わ せて、JIS X 14533-1 として新たに制定し、JIS X 5092:2008 を廃 止する。	-	一般財団法人日本情報 経済社会推進協会のWG	2024年4月

JIS作成予定(一覧表)(廃止)

2024年12月17日現在

認定機関	産業標準 作成委員会	制定/ 改正/ 廃止	規格番号	JIS案の名称 (廃止の場合は, 現行JISの名称)	JIS案の英文名称 (廃止の場合は, 現行JISの英文名称)	廃止する理由	対応する国際規格番号 及び名称	対応する国際規格との 対応の程度	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始 予定
JSA	07 情報	廃止	X5093	XML署名利用電子署名(XAdES) の長期署名プロファイル	Long term signature profiles for XML advanced electronic signatures(XAdES)	JIS X 5093:2008が元となった国際規格ISO 14533-2が、関連する規格としてJIS X 5092:2008が元となったISO 14533-1が発行されている。ISO 14533-1及びISO 14533-2は、欧州規格との整合化のため、改訂が行われており、JIS X 5092:2008及びJIS X 5093:2008も同様に改定が必要となっている。一方、ISO 14533シリーズにISO 14533-3が発行されているが、対応するJISがないことから、そのJISの制定も望まれている。 今回、JIS X 5093:2008の内容を更新するとともに、国際規格とJISとの関連性を明確化するために、規格番号を国際規格に合わせて、JIS X 14533-2として新たに制定し、JIS X 5093:2008を廃止する。			一般財団法人日本情報 経済社会推進協会のWG	2024年4月